

УДК 664:005.936.43

Ігнатов А. А.<sup>1</sup>, Сніжної Г. В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> студ. гр. РТ-410 НУ «Запорізька політехніка»

<sup>2</sup> д-р. техн. наук, проф. НУ «Запорізька політехніка»

## **НУЛЬ ДЕФЕКТІВ – НОВИЙ ВИМІР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ**

Microchip Technology Incorporated є провідним постачальником програмованих вбудованих рішень керування, поставляючи популярні мікроконтролери PIC, широкий спектр інноваційних аналогових продуктів, відповідних продуктів енергонезалежної пам'яті та рішень Flash-IP. Система управління якістю (СУЯ) є основою для задоволеності клієнтів і постійного вдосконалення всіх аспектів роботи та спрямована на досягнення нульової кількості дефектів. Виробничі можливості включають перетворенні кремнію в кінцевий продукт, а саме виготовлення та тестування пластин. Технічні характеристики полягають контролю якості на всіх операціях виготовлення, складання та тестування.

Microchip використовує різні статистичні методи для характеристики, контролю та зменшення мінливості виробничих процесів. Для цього застосовують відповідні методи статистичного аналізу, включаючи: аналіз конструкції та усунення потенційних проблем і механізмів відмови, еталонний стандарт для процесу, заснований на кваліфікації процесу та дослідженнях можливостей, статистичні інструменти для забезпечення аналізу процесів у реальному часі та зворотного зв'язку; статистичні інструменти (наприклад, дизайн експериментів, аналіз Парето, діаграми тенденцій, графіки ймовірностей, методи аналізу надійності) для виявлення головних проблем, визначених причин і прямих дій щодо покращення за допомогою внутрішніх систем коригувальних і запобіжних дій.

Програма якості та постійного вдосконалення базується на концепції «Нуль дефектів» (рис. 1), інструменті управління, спрямованому на зменшення кількості дефектів шляхом запобігання та «робимо правильно з першого разу».



Рисунок 1 – Концепція нульових дефектів